

(12) 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006 年 1 月 12 日 (12.01.2006)

PCT

(10) 国
WO 2006/003785 A1

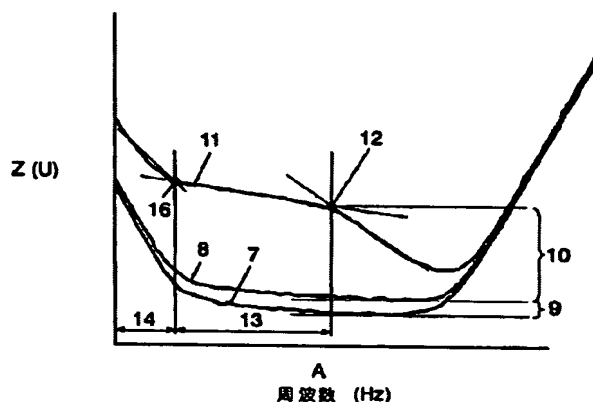
(51) 国際特許分類: G01R 27/02, 27/26, H01G 13/00
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/010847
(22) 国際出願日: 2005 年 6 月 14 日 (14.06.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権子ータ: 特願 2004-193649 2004 年 6 月 30 日 (30.06.2004) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電
器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.) (JP/JP); 〒5718501 大阪府門真市大
字門真 1006 番地 Osaka (JP).
(72) 発明者: および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 清水 俊明
(SHIMIZU, Toshiaki). 大橋 敏彦 (OHASHI, Tosh-
hiko).

(74) 代理人: 岩橋 文雄, 外 (IWAHASHI, Fumio et al.); 〒
5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地松下電
器産業株式会社内 Osaka (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護
が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GI, GM, GR,
GU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU,
SC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SN, ST, SV, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GI, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), キーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

[続あり]

(54) Title: CAPACITOR DETERIORATION JUDGMENT METHOD

(54) 発明の名称: キャパシタの劣化判定方法



A.. FREQUENCY (HZ)

(57) Abstract: There is provided a capacitor deterioration judgment method using the AC impedance method improving the mea-
surement accuracy and reliability. In this capacitor deterioration judgment method, AC voltage is applied to a capacitor having a
pair of electrodes and electrolyte arranged between the electrodes, so that the impedance characteristic caused by the AC voltage
frequency is measured so as to judge the deterioration. An inflection point (12) appearing in the impedance characteristic by deterio-
ration of the electrolyte is obtained in advance and the impedance value of the frequency area (13) lower than the inflection point
(12) is compared to perform deterioration judgment.

(57) 要約: 測定精度を高めて信頼性を向上した交流インピーダンス法によるキャパシタの劣化判定方法が開示さ
れている。このキャパシタの劣化判定方法は、一対の電極体と電極体間に配置された電解液とを備

[続あり]